



Рис. 1. Спектры КРС образцов твердого раствора $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ при $x = 0,3$
 (1 – исходные образцы; 2 – образцы после обработки в водородной плазме;

3 – образцы после обработки в водородной плазме и термообработки при 275°C в течение 20 мин)

Fig. 1. Raman spectra of samples of the $\text{Si}_{1-x}\text{Ge}_x$ solid solution at $x = 0.3$

(1 – initial samples; 2 – samples after treatment in hydrogen plasma;

3 – samples after treatment in hydrogen plasma and heat treatment at 275°C for 20 min)